

Jacques Werckmann
Professeur en visite à l'Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), Brésil

**La microscopie électronique en transmission en mode balayage :
un outil indispensable pour l'étude des nanostructures**

Durant ces dix dernières années la microscopie électronique en transmission en mode balayage (STEM, Scanning Transmission Electron Microscopy) est devenue une méthode communément utilisée pour caractériser les nanomatériaux. Plusieurs types d'images peuvent être acquises simultanément qui renseignent à la fois sur la structure et la chimie des objets étudiés. Le récent développement des correcteurs d'aberrations sphériques a permis d'obtenir ces informations à l'échelle atomique.

Dans cet exposé je présenterai les résultats que nous avons obtenus dans l'étude du système Ge/LaAlO₃ (001).